

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60749-9

Première édition
First edition
2002-04

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 9:
Permanence du marquage**

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**

**Part 9:
Permanence of marking**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60749-9:2002